

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

例えば透過型電子顕微鏡(T E M)等による観察, 分析, 計測に用いられる微小試料の作製(加工)方法、並びに、その方法を実施するために用いられる試料作製(加工)装置について開示されている。本発明の試料作製(加工)方法においては、試料基板上から分離・摘出すべき試料片をはり部材の先端部に形成された複数の分岐はり間に挟み込んで保持し、この試料片を保持したはり部材を試料載置台上に移動させて、該試料載置台上に上記試料片を載置(固定保持)させる。試料載置台上に試料片を載置した後に、上記はり部材は載置された試料片から引離し分離される。かかる試料片の分離・摘出、並びに載置方法を採用することによって、試料基板上の所望領域から微小な試料片を精確かつ安定に分離・摘出して、汚染の少ない信頼性の高い観察, 分析, 計測用の試料を短時間で、効率良く作製することができる。